

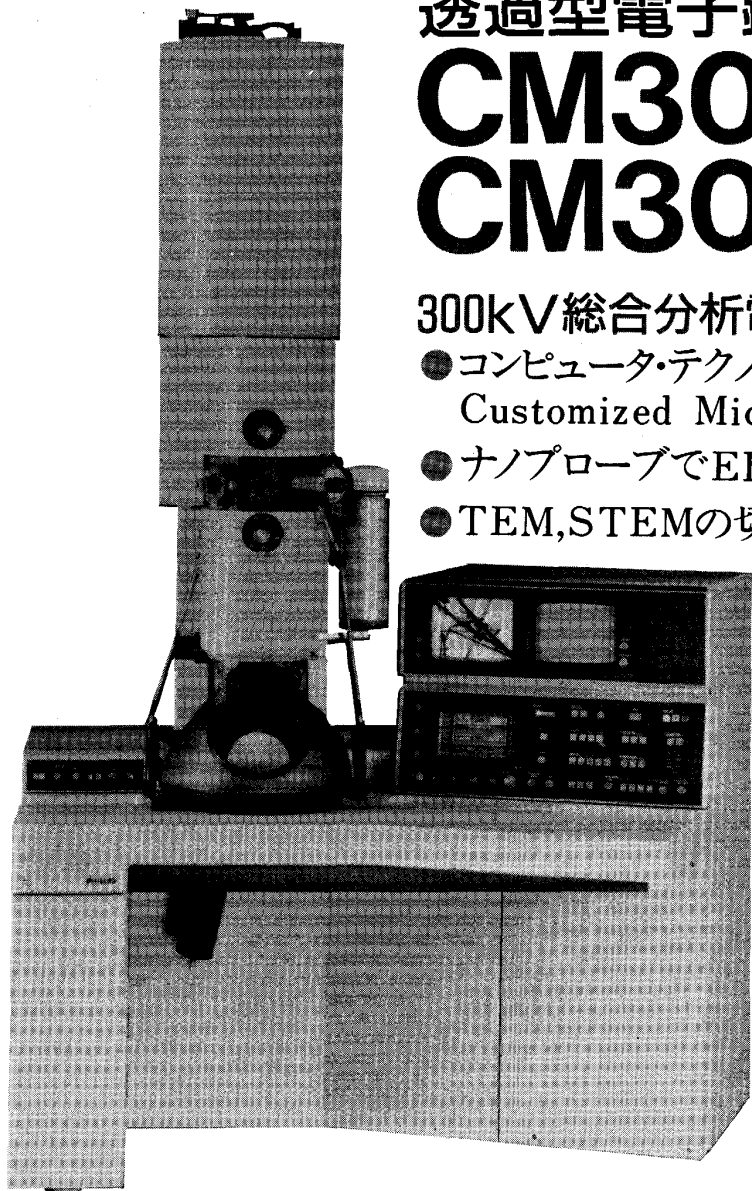


**PHILIPS**

# 透過型電子顕微鏡 300kV CM30 CM30/STEM

300kV総合分析電子顕微鏡

- コンピュータ・テクノロジーを駆使した Customized Microscope。
- ナノプローブでEDX,EELSの分析。
- TEM,STEMの切り換えは瞬時。



**新シリーズ登場**

- CM10 (100kV)
- CM12 (120kV)/STEM
- CM30 (300kV)/STEM

**新発売**

**CM30/STEMの特長**

- 収差の少ない第2世代TWINレンズおよび、Super TWINレンズを使用。
- 高角度試料傾斜(±60°)で高解像画像が得られる。
- 高角度収束電子回折(WACBD) および回折パタンの投影角も20度。
- 自動倍率色収差補正。
- 超高真空(独立2系統排気方式、保持圧力差×10<sup>4</sup>、1・G・P標準装備)。
- マイクロコントローラーによる操作つまみの減少。
- フリーレンズコントロール。
- コンパクトな設置スペース(W3×D4.5×H2.9 m)。

**日本フィリップス株式会社**  
《産業機器事業部・電子機器課》

本社 〒108東京都港区高輪3-26-33(秀和品川ビル) TEL.(03)448-5770(直通)  
大阪支店 〒541大阪市東区今橋2-22(藤浪ビル) TEL.(06)231-7871(代表)  
筑波出張所 〒305茨城県つくば市竹園2-8-6(つくしビル) TEL.(0298)52-9940(直通)

昭和六十三年四月一日発行(一日発行)印刷人:東京板橋区熊野町十三十一倉沢直則